

Judul:

Digital circuit testing and testability / Parag K. Lala

Pengarang/Penulis:

Lala, Parag K.

Subjek:

Integrated circuits--Very large scale integration--Testing; Digital integrated circuits--Testing; Integrated circuits--Fault tolerance

Nomor Panggil:

621.39 LAL d

Penerbitan:

Academic Press

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)